

書籍のご案内

ひずみゲージ試験 I 問題集 2019

編集：(一社)日本非破壊検査協会
編集委員長 高山 博光
体裁：B5版, 64頁
発行：令和元年12月10日
定価：本体1,400円+税(送料別)

ひずみゲージ試験に携わる技術者に長く親しまれてきた非破壊検査技術シリーズ「ひずみ測定 I」及び「ひずみ測定問題集」が、JIS Z 2305:2001 非破壊試験技術者の資格及び認証と整合性をもたせるために2007年から2009年にかけて改訂・刊行されて、ほぼ10年が経過した。

その間、JIS Z 2305:2013への改正があり、ひずみ測定(SM)がひずみゲージ試験(ST)となった。また、認証機関(一般社団法人 日本非破壊検査協会)によって承認された教育・訓練の目的及び内容、使用テキスト、参考文献、評価方法などについて記した要綱である「シラバス」が規定され、新たな項目として品質及び歴史などが加えられるなど、大幅な改正が行われた。それにともなって2017年に改訂された非破壊検査技術シリーズ「ひずみゲージ試験 I」でも大きな見直しを行った。

このようなJISの改正、シラバスの規定に適合したテキストの改訂に対応させるように、ひずみゲージ試験 I 問題集 編集委員会において議論を重ねて、全面的に内容の見直しを行い改訂し、「ひずみゲージ試験 I 問題集」を刊行する運びとなった。

この問題集は、ひずみゲージ試験に関して JIS Z 2305 に記載されている

NDT レベル1 技術者が習得しなければならない事項について、対応する書籍である非破壊検査技術シリーズ「ひずみゲージ試験 I」の内容と合致するように編集されており、対応するテキストと合わせて学習することによって、より深い理解が得られ、JIS Z 2305 に規定されているレベル1の認証試験の受験用にも十分に役立つ内容であるとともに、ひずみゲージ試験に関して知識を得るためにも使えるように配慮している。

なお、これまでレベル I, II 及び III がまとめられていた問題集を、今回の改訂において読者のニーズを配慮し、レベルごとの分冊とした。これによって、着実なレベルアップにつながるものと期待される。

読者が本書による学習を通して技術を習得して、ひずみゲージ試験の実務に役立てていただくとともに、非破壊検査技術者の道に進まれることを心から希望するものである。

(はしがきより抜粋)

